

# 酸化物超電導材料の臨界電流測定評価法の開発

米国NISTと共同研究

酸化物系の超電導材料は金属系に比べて遥かに高い臨 界温度(Tc)を有することから、その実用化に対する期待 が世界的に高まっている。しかし、この新しい物質群 は,金属系と異なる特性,挙動を示すため,酸化物超電 導材料を実用化するには、それらを適切に評価する新た な技術が必要となる。当研究所は平成4年から米国標準 技術研究所(NIST)と共同して酸化物超電導材料の臨 界電流(Ic)測定評価法に関する基礎的な研究を行ってい る。その実施に当たっては当研究所が標準試料の設計・ 開発を、NISTが測定装置の設計・開発を主に担当し、 相互に研究者を派遣して共同研究を進めている。その主 な内容は2項目から成る。

(1) 両研究所の臨界電流測定系の比較。

酸化物超電導材料の臨界電流を測定する標準的方法を 確立するため,まず,両研究所の測定系の誤差因子を把 握する目的で、NISTにおいて開発した超電導体臨界 電流測定用シミュレータ(図1)を用いて測定系のチェッ クを行うとともに,臨界電流自動測定プログラムを共同 で開発した。今後は、直流法およびパルス法等の異なる 臨界電流測定法間の比較を行う。



(2) 標準試料の作製。

材料の標準的測定評価法の確立には、標準試料による 測定の比較が重要である。このため、両研究所で標準試 料を検討し、設計・作製した。標準試料には、当研究所 が開発したビスマス系 2212 相 (Bi2Sr2CaCu2Ox, x ~8) を選び、ドクターブレード法(金材技研ニュース, 1990年 No.9) により酸化物超電導体の前駆体(絶縁体)を作製して厚さ 50µmの銀基板上に乗せ、これを部分溶融法により熱処 理して試料を形成させた。さらに、試料を補強するため 両面テープで厚さ0.5mmの真ちゅう板に貼り付け,標準試 料とした。(図2)。これを用いて臨界電流に及ぼす,

(1) 試料電流・電圧端子の接合部における接着剤と発熱 の影響

(2)試料冷却速度の影響

(3) 試料の保存状態/熱サイクルによる影響

を詳細に調べている。なお、ヴェルサイユサミットプロ ジェクト(VAMAS)においても、酸化物超電導材料の 標準化に多国間で取り組むための国際共同研究班が、当 研究所を議長機関として近々発足する。



酸化物超電導体標準測定試料

# 高温超電導体にジョセフソン接合が内在

酸化物高温超電導体は、図1に見られるように特徴的 な層状の結晶構造を持つことから、コヒーレンス長 と等、 超電導状態を記述する物理的パラメーターには著しい異 方性が現れる。中でもBi2Sr2CaCu2O8系の超電導体は 最も異方性の大きい部類に属し,異方性パラメーター γの値は300以上にも達すると考えられている。コヒーレ ンス長 とも同程度の異方性を持つと考えられ、層状を成 すa-b面内の ξab が約23Å であることから,層に垂直な方 向のを。は0.1Å以下と推定される。この値は図1中, c-軸 方向のCuO2面の周期性15Åと比べて遥かに小さい。超電 導は,層状構造の中のCuO₂面内に集中して起こり,他の 層,例えばBi2O2層は半導体的もしくは絶縁体的であると さえ言われる。このようにBi2Sr2CaCu2O8 系は強い2次 元性を示し,層間が弱く結合した超電導体であることから, 超電導状態における物性に従来の超電導体では見られな かった種々の異常現象が現れる。この特異な物性の機構 解明並びに有効利用法の探索が待たれるところである。

当研究所では、 $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$ の良質な大型単結晶 を育成し、それを用いて実験を行った結果、結晶の各単位 胞内には層間の弱結合に起因したジョセフソン接合が存 在すると云う結論に達した。それを以下に紹介する。図 2は $Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$ 単結晶のc-軸方向の電流電圧 (I-V) 特性を示す。実験には厚さ10~30 $\mu$ mの板状試料の両面 に銀を約1 $\mu$ m程蒸着して電極とし、約100×100 $\mu$ mの大き さに切断したものを用いた。測定は2端子法で行なった。 この図に現れた特徴的な現象を列挙すると、①電流増加 時と下降時でI-V特性に大きなヒステリシスが現れる。② このヒステリシスは、電流の符号反転に対し対称的に起 こる。③ヒステリシスの幅は、超電導臨界温度(Tc)直下 を除いて温度にほとんど依存しない。④Tc直下を除いて は、臨界電流値Icで鋭い電圧の跳びを示す。⑤比較的低 温領域では, I-V特性が裾をひき, 多数の小さな電圧のス テップが観測される。このうち、①、②、③は容量結合 性ジョセフソン接合が示す典型的な特徴であることに気 付く。また図3に示した c-軸方向の臨界電流密度 Icの 温度依存性は, ジョセフソン接合の臨界電流の温度依存 性に関するAmbegaokar-Baratoffの理論と良く一致して おり、この物質にジョセフソン接合が内在していること を示唆する。これをさらに進めて、結晶の単位胞内にジ ョセフソン接合が2つ存在すると解釈すれば上述の複雑 な現象は全て矛盾なく説明できる。④はジョセフソン臨 界電流Icが試料内で均一であることを示している。また、 ⑤に関しては、図を拡大するとステップの大きさに基本 単位(約0.2~0.3mV)があり、小さな跳びはその基本単位 または整数倍の値をもつことがわかる。超電導状態から 常電導状態に転移した時の電圧差(約3V)と基本単位の 電圧との比は約(1~5)x10<sup>4</sup>となり、これは結晶内に推定 されるジョセフソン接合の数,例えば厚さ20µmの試料 中には約13,000個、とまさしく一致する。これら諸々の実 験事実は、結晶の単位胞内にジョセフソン接合が存在す ることの直接的検証である。

ジョセフソン接合の応用として,高速コンピューター, 光検出器,ミキサー,スクイド等があり,原子層制御技 術等を駆使した薄膜素子の作製が期待され,多くの研究 がこれまでに行われてきた。しかし超電導のコヒーレン ス長が原子サイズであることなどから,良質かつ再現性 のある接合素子はまだ実現していない。今回,良質で大 型の単結晶を用いて行った実験の結果は,結晶に内在す るジョセフソン接合を巧みに利用することにより高温超 電導体ジョセフソン接合素子の簡便な作製法が可能であ ることを示している。近い将来,この方面における高温 超電導体の応用の実現が大いに期待できる。









図3 Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>単結晶 c-軸方向のジョセフソン臨界 電流密度の温度依存性

## 負荷応力下の複合材料内部損傷をその場観察

- シンクロトロン放射光で X 線断層撮影 —

X線CT(断層撮影)法は医学の診断に応用され急速に 発展した技術である。最近,工業用材料の内部構造や組 織の非破壊検査法としても注目されているが,従来の工 業用X線CTでは分解能が約250µmであり,複合材料の 強化繊維として用いられる炭化ケイ素(SiC)繊維やボロン (B)繊維の直径が通常約140µmであるのに比べて大きい。 また,金属基複合材料では,強化繊維と母材との界面剝 離,内部繊維の破断,母材の未侵入部,衝撃に伴う損傷,き 裂などが存在することがある。これら種々の欠陥や損傷 は材料に応力が働いた場合,破壊の起点となって重大な 事故につながる可能性がある。このようなことから,複 合材料の評価には非破壊的手法が重要であり,分解能に 優れかつ短時間に評価可能なX線CT法の開発が望ま れる。それには波長が揃った強力X線源を必要とする。

当研究所では、日立研究所との共同研究により、シン クロトロン放射光(高速で走る電子が磁場によって運動 方向を曲げられるとき接線方向に放出する電磁波)を利 用したX線CTを用いて、金属基複合材料の応力下にお けるその場観察を行った。実験には高エネルギー物理学研 究所(筑波)放射光施設BL-8Cを用いた。実験装置の構成 を図1に示す。左側から放射光が入り、それをシリコ ンモノクロメータで単色化し平行なX線ビームにする。 その波長は0.05nmで、強度は10<sup>5</sup>フォトン数/mm<sup>2</sup>である。 応力負荷装置に取り付けた試料に負荷をかけながら、1度 刻みに180度回転させ、各角度位置でX線の透過画像を2 次元撮影管で検出する。そして各角度に対して得た透過 X線強度をコンピュータ処理して断層画像を再構成する。 なお1枚の透過画像を得るのに要した時間は約30秒である。 実験に用いた複合材料は、SiC短繊維(直径140µm、長 さ約1mm)とAl合金の粉末をブレンドした後,押出し加工 したものでありサイズは1mm  $\phi \times 30$ mmである。負荷応力を 押出し方向にかけ,X線ビーム位置を試験片平行部の中 央部に定め,押出し方向に対して垂直に照射した。

写真1(a),1(b)に示した4枚の写真は同一試料のX線断 層像である。1(a),1(b)はそれぞれ耐力および破断応力に ほぼ相当する5.6MPa, 6.9MPaの応力を掛けた時の断層 像で、左と右の像は断層の位置(高さ)が異なる。写真の 中で,黒く見えるのはX線の吸収が少なかった箇所であ り, SiC 繊維用の炭素芯線, 試料中のボイド, 応力下で 繊維の引き抜きが起きた所などが黒く映る。炭素芯線は 直径30µmで,黒い丸として明瞭に識別できる。写真1(a) においてSiC 繊維が半分欠けたものやボイドが認められ、 内部配列および組織が観察できる。写真1(a)と1(b)を詳細 に比較して見ると,破断応力付近ではボイドが成長し,繊 維の引き抜きも起きていることがわかる。また、マトリ ックスと繊維との界面に剝離が起きた箇所も認められる。 写真1(b)と同様に破断応力をかけた試料について,断層位 置の異なる10枚の像から3次元立体構築したものが写真 2である。上下方向が押出し方向に対応しており、繊維 の長さにバラッキがあるものの押出し方向に一様に並ん でいるのがわかる。

このように放射光を用いたX線CT法によって,複合 材料の内部構造の定量的評価,ならびに,応力下で生じ るボイドの成長や強化繊維の引き抜き等の,内部損傷過 程を高精度かつ非破壊的にその場観察できる。本方法は 今後,複合材料の破壊機構の解明に有力な手段となり得 るものであり,その重要な基礎を築いたものとして今回 の実験の成功がもつ意義は大きい。



図1 放射光X線CT装置の構成図

写真1(a) 耐力付近の断層像



写真1(b) 破断応力付近の断層像

0.5mm



写真2 3次元立体構築像

## 9月の研究発表(国内分)

学・協会名	開催期間	発 表 題 目	発表者 (所属)
材料設計及びプロセス工学の コンピュータ利用国際会議 (東京・日本都市センター)	9.6~9.9	<ol> <li>Characterization of the Microstructure in a Ti-6Al-4V Alloy by the Sensory Test and Its Application.</li> <li>Modeling of hcp/D019 Phase Equilibrium by the Cluster Variation Method.</li> <li>Simulation System of Nuclear Transmuta- tion and Radioactivation.</li> </ol>	金子 隆一(設計)ほか 阿部 太一(設計)ほか 藤田 充苗(第2)ほか
イオンビームによる金属の表 面改質に関する国際会議(金 沢・金沢市文化会館)	9.13~9.17	1. Modification of Ultrathin Superconducting BiSrCaCuO System Films by Ar Ion Beams	貝瀬 正次(表面)ほか
<b>錯体化学討論会</b> (価合・東北 大学)	9.14~9.16	<ol> <li>フタロシアニンを配位したアンチモン(III)錯体 の合成と性質</li> <li>ビス(フタロシアニナト)スカンジウム(III)お よびアセタト(フタロシアニナト)スカンジウ ム(III)錯体の合成と性質</li> </ol>	加賀屋 豊(反応)ほか 砂金 宏明(反応)ほか
<b>日本化学会</b> (西宮・関西学院 大学)	9.27~9.30	<ol> <li>アンチモン-フタロシアニン錯体の合成</li> <li>一連のビス(フタロシアニナト)希土類金属錯体の諸性質におけるセリウム錯体の異常な振舞い</li> </ol>	加賀屋 豊(反応)ほか 砂金 宏明(反応)ほか
<b>溶接学会</b> (名古屋・愛知県産 業貿易館)	9.30~10.2	<ol> <li>アルゴン-水素混合ガス雰囲気におけるGTAプ ラズマ特性</li> <li>応力又はひずみ制御試験によるSUS304HP鋼 の疲労特性の評価</li> </ol>	平岡 和雄(組織) 鈴木 直之(環境)ほか

#### ◆短 信◆

賞

●受

日本金属学会研究技術功労賞

#### 材料試験業務課 今村国昭

多年にわたり卓越した技術により材料強度データシート作成プロジェクト遂行に協力し、大きく貢献した ことにより平成5年3月31日、上記の賞を受けた。

#### 日本鋳物協会小林賞

環境性能研究部 田原 晃

「厚肉フェライト球状黒鉛鋳鉄における水素の挙動」 により、平成5年5月26日、上記の賞を受けた。

#### ●人事異動

平成5年6月25日

配	置	换	長官官房付	中野昭二郎	(管理部長)
配	置	换	管理部長	木下 舜	(長官官房付)

平成4年度日本材料学会学術賞

損傷機構研究部 岸本 哲

「321ステンレス鋼のクリープ中の粒界すべりと表面 き裂の生成」により、平成5年5月26日、上記の賞を 受けた。

配置換 原子力安全局原子力安全課防災環境対策
 室長 松岡 浩(管理部企画課長)
 昇 任 管理部企画課長 石井 利和(原子力局)

原子力開発機関監理官補佐)

#### ●海外出張

氏	名	所属	期 間	行先	用務
櫻井	健次	計測解析研究部	$5.6.1 \sim 6.5.31$	連合王国	X 線を用いた薄膜のキャラクタリゼーション の新手法に関する研究

Ο-

### 発行所科学技術庁金属材料技術研究所

(4)	19F7	〒155 <b>宋</b> 京仰日羔区中日羔 Z = 5 = 12
		T E L (03) 3719-2271, F A X (03) 3792-3337
(筑波支	乞所)	〒305 茨城県つくば市千現1-2-1
		TEL (0298) 51-6311, FAX (0298) 51-4556

通巻 第416号	平成5年8月発行
编集兼発行人	石 井 利 和
問 合 せ 先	管理部企画课普及係
印 刷 所	株式会社 三 興 印 刷
	東京都新宿区西早稲田2-1-18